

D30VC60

600V 30A

## 特長

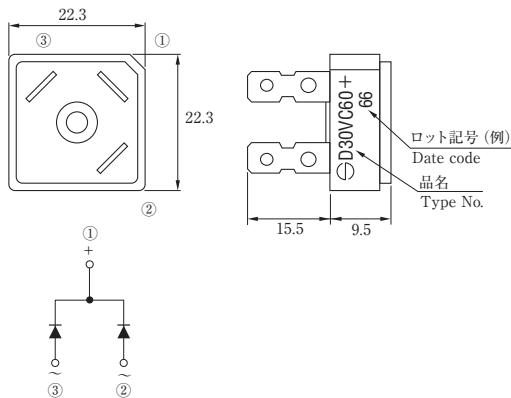
- ・耐湿性に優れ高信頼性
- ・低  $I_R$
- ・高耐熱性
- ・ファストン端子

## Feature

- High-Reliability
- Low  $I_R$
- Heat Resistance
- Faston terminal

## ■外観図 OUTLINE

Package : D30VC

Unit : mm  
Weight : 12g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

## ■定格表 RATINGS

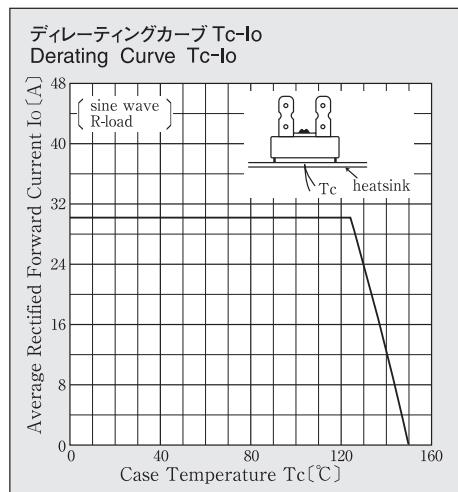
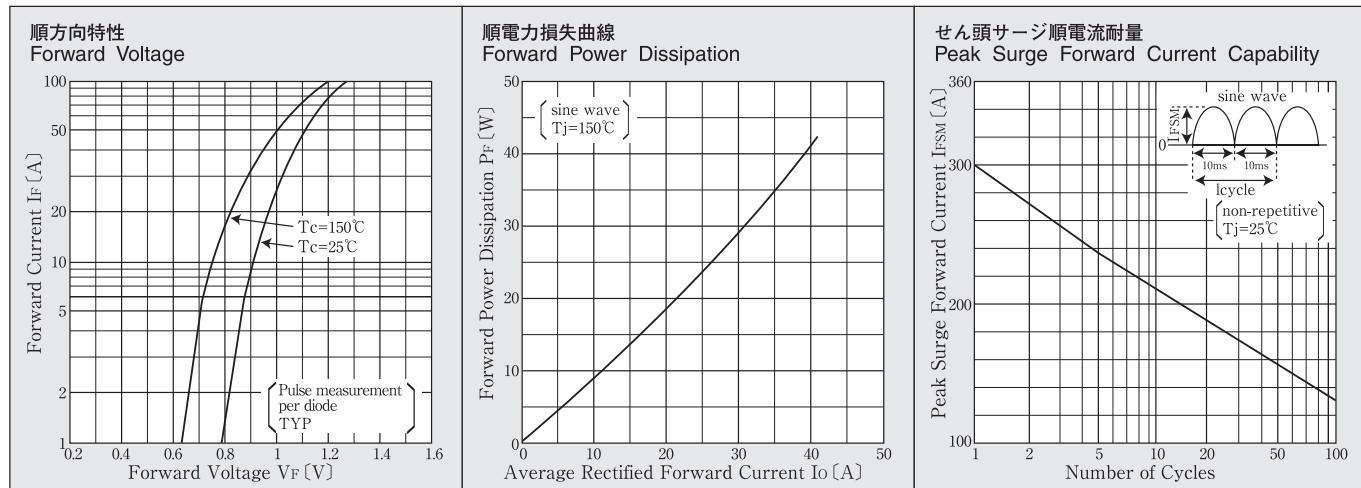
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D30VC60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	$T_j$			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{RM}$			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	$I_O$	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, フィン付き, $T_c=124^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, With heatsink, $T_c=124^\circ\text{C}$		30	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$		300	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	$I^2t$	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$ , $T_j=25^\circ\text{C}$		300	$\text{A}^2\text{s}$
絶縁耐圧 Dielectric Strength	$V_{dis}$	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	$T_{OR}$	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque: 0.5 N·m)		0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F=15\text{A}$ , パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R=V_{RM}$ , パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	$\mu\text{A}$
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jc}$	接合部・ケース間 Junction to Case	MAX 0.9	$^\circ\text{C}/\text{W}$

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine wave は 50Hz で測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
 Typical は統計的な実力を表しています。  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.